

# H28導入 ものづくりを支援する最新装置 ICP発光分光分析装置

## 【装置概要】

高周波誘導プラズマ（ICP）中に液体試料を導入して試料中の元素を発光させ、その発光強度を測定する装置です。

微量から高濃度まで対応しており、同時に多くの元素を測定することができます。

材料の主成分や微量成分の分析、排水中の有害金属の検出等幅広い分野で使われます。



化学製品、金属、セラミックス、食品、医薬、環境等様々な試料の測定が可能

## 【仕様】

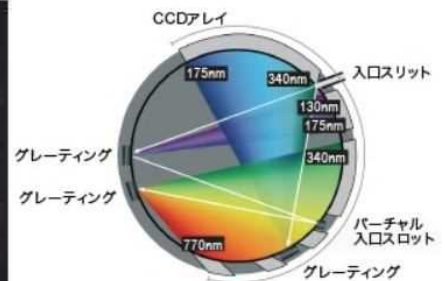
名称・型式	SPECTRO ARCOS MV130・FHM22
測光方式	Multi Viewタイプ 側面方向測光（SOP,ラジアル）と軸方向測光（EOP,アキシャル）を切替え使用
測定波長範囲	130nm～770nm
測定対象元素	Li, Be, B, Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se, Br, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Ru, Rh, Pd, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Te, I, Cs, Ba, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Hf, Ta, W, Re, Os, Ir, Pt, Au, Hg, Tl, Pb, Bi, Th, U
検出器	リニアCCDアレイ32個（ポリクロメーター）
マウント方式	トリプルパッシェンルング
グレーティング （回折格子）	3600本/mm（130nm～175nm, 175nm～340nm） 1800本/mm（340nm～770nm）
国内総代理店	株式会社日立ハイテクサイエンス



側面方向測光の様子



軸方向測光の様子



トリプルパッシェンルングの構造図